

**Test documentation for MICROS Optics Test Panels
according to American standards**

micros
optics
www.micros-optics.com



RSF Elektronik

Ges.m.b.H.

Elektronische Längen- und
Winkelmessgeräte,
Kabelsysteme, Präzisionsteilungen

**MICROS Optics test panel for SCRATCHES AND DIGS according to
American standards; item 10207**

Checking of the applied photolithographic structures

Test feature: Length and width of the structure in the case of scratches. Diameter for digs

1. Scratches (units in mm)

Feld											
5		10		20							
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,005	16	0,0050	16,0013	0,01	16	0,0099	16,0009	0,02	16	0,0200	16,0004

Feld											
40		60		80							
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,04	16	0,0403	16,0004	0,06	16	0,0602	16,0001	0,08	16	0,0799	15,9996

Feld											
120											
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,12	16	0,1198	15,9993								

2. Digs (units in mm)

Feld											
5		10		20		30		40		50	
Soll	Ist										
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
0,05	0,0499	0,10	0,1002	0,20	0,1998	0,30	0,3000	0,40	0,3999	0,50	0,4999

Feld											
70		100									
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Ø	Ø	Ø	Ø								
0,70	0,7002	1,00	1,0000								

Tarsdorf, 11.01.2022

SIGN